(19)日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-74802

(43)公開日 平成10年(1998)3月17日

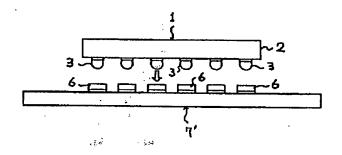
(51) Int. Cl. 6 H 0 1 L G 0 1 N H 0 5 K	識別記号 21/60 3 1 1 23/04 3/34 5 1 2	庁内整理番号	F I H O 1 L G O 1 N H O 5 K	21/60 3 1 1 S 23/04 3/34 5 1 2 A	技術表示箇所
	審査請求 未請求	請求項の数3 -	OL	(全6頁)	
(21)出願番号	特願平8-229947		(71)出願人	390035747 株式会社シム	
(22)出願日	平成8年(1996)8月30日			神奈川県横浜市金沢区福	浦1丁目1番地1
			(72)発明者	向 山 敬 介 神奈川県横浜市金沢区福 株式会社シム内	浦1丁目1番地1
			(72)発明者	斎 藤 明 神奈川県横浜市金沢区福 株式会社シム内	浦1丁目1番地1
			(74)代理人	弁理士 西山 春之	
	•	-		·	

### (54)【発明の名称】ポールグリッドアレイパッケージの接続構造及びその接続検査方法

### (57)【要約】

【課題】 ボールグリッドアレイバッケージの接続構造において、相手側のプリント配線基板に対するボールグリッドアレイバッケージの接続状態の良否を容易に検査可能とする。

【解決手段】 底面に端子として半田ボール3を2次元のアレイ状に配列して成るボールグリッドアレイパッケージ1の上記半田ボール3と、表面に設けられたパッド上に半田6を印刷して成る相手側のブリント配線基板7,の上記パッド上の半田6とを位置合わせし、それらを加熱溶融することによりブリント配線基板7,にボールグリッドアレイパッケージ1を半田付けするボールグリッドアレイパッケージ1を半田付けするボールグリッドアレイパッケージ1の半田ボール3の平面形状と、プリント配線基板7,のパッド上の半田6の平面形状とを相互に異なった形状とし、その平面形状内で互いに位置合わせ可能としたものである。



#### 2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 底面に端子として半田ボールを2次元のアレイ状に配列して成るボールグリッドアレイバッケージの上記半田ボールと、表面に設けられたバッド上に半田を印刷して成る相手側のプリント配線基板の上記バッド上の半田とを位置合わせし、それらを加熱溶融することによりプリント配線基板にボールグリッドアレイバッケージを半田付けするボールグリッドアレイバッケージを半田付けするボールグリッドアレイバッケージの接続構造において、上記ボールグリッドアレイバッケージの半田ボールの平面形状と、ブリント配線基板のバ 10ッド上の半田の平面形状とを相互に異なった形状とし、その平面形状内で互いに位置合わせ可能としたことを特徴とするボールグリッドアレイバッケージの接続構造。

【請求項2】 上記ボールグリッドアレイバッケージの 半田ボールの平面形状を略円形とし、プリント配線基板 のバッド上の半田の平面形状を上記半田ボールの平面形 状を内側に含んだ大きさの多角形状としたことを特徴と する請求項1記載のボールグリッドアレイバッケージの 接続構造。

【請求項3】 ボールグリッドアレイバッケージの底面 20 に端子として2次元のアレイ状に配列された半田ボールの平面形状と、相手側のプリント配線基板の表面に設けられたバッド上に印刷された半田の平面形状とを相互に異なったものとしておき、上記ボールグリッドアレイバッケージの半田ボールとプリント配線基板のバッド上の半田とをその平面形状内で互いに位置合わせし、それらを加熱溶融することによりプリント配線基板にボールグリッドアレイバッケージを半田付けした後に、X線を上記プリント配線基板の真上又は真下から照射し、X線検出器でその透過X線像を検出し、それらから得られる検 30 査画像のバターンを解析して半田付けの接続状態の良否を判定することを特徴とするボールグリッドアレイバッケージの接続検査方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、底面に端子として半田ボールを2次元のアレイ状に配列しIC (集積回路)等のパッケージとして用いられるボールグリッドアレイパッケージ (以下「BGAパッケージ」と略称する)をプリント配線基板に半田付けするボールグリッドアレイパッケージの接続構造に関し、特に相手側のプリント配線基板に対するBGAパッケージの接続状態の良否を容易に検査可能とすることができるボールグリッドアレイパッケージの接続構造及びその接続検査方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】BGAバッケージとは、近年開発され電子部品の小型、軽量、多機能化を実現する新しい表面実装タイプのICバッケージであり、外部端子として従来のリードを用いず、バッケージの底面に配列された半田 50

ボールを端子として接続する方式の電子部品である。ここで、現在あるBGAバッケージ1は、図1に示すように、内部に半導体チップを封止したパッケージ本体2の底面に端子として球状の半田ボール3,3,…を2次元のアレイ状に配列して構成されている。なお、図1

(a) において、符号 4 は上記パッケージ本体 2 の底面 に形成されたパッドであり、このパッド 4 の位置に半田 ボール 3, 3, …が図 1 (b) に示すようにマトリスク 状に印刷されている。

【0003】そして、このBGAパッケージ1をプリン ト配線基板に接続するには、図8に示すように、上記B GAバッケージ1の半田ボール3と、表面に設けられた バッド5上に例えば半球状の半田6 (クリーム半田な ど)を印刷して成る相手側のプリント配線基板7の上記 パッド5上の半田6とを位置合わせし、一括リフロー方 式でそれらを加熱溶融することにより、プリント配線基 板7にBGAパッケージ1を半田付けしていた。このと きの、プリント配線基板7とBGAバッケージ1との接 続状態は、図9に示すようになる。すなわち、BGAバ ッケージ1の半田ボール3とプリント配線基板7の半田 6とが十分に接合されている場合は、溶けた半田の表面 張力により円柱状の固形半田8となり、接続良好とな る。また、場所によってBGAパッケージ1の半田ボー ル3とプリント配線基板7の半田6とが接合されていな い場合は、半田ボール3と半田6とがやや離れた状態で 固まり、いわゆる「浮き」となって電気的に接続されず 接続不良となる。

【0004】このようなBGAバッケージ1の接続状態を検査するには、図10に示すように、表面にBGAバッケージ1を接続したプリント配線基板7の上方又は下方にX線源9を配置し、これと対向させて上記プリント配線基板7の下方又は上方にはX線カメラ等のX線検出器10を配置して、上記X線源9からBGAバッケージ1の接続部にX線11を照射し、その透過X線像11′をX線検出器10で検出し、それらから得られる検査画像のパターンを解析して半田付けの良否を判定していた。

# [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従来のBGAパッケージの接続構造においては、図8に示すBGAパッケージ1の半田ポール3の平面形状(略円形)とプリント配線基板7の半田6の平面形状(略円形)とが略同等となっていたので、図9に示すプリント配線基板7とBGAパッケージ1との接続状態において、良好な接続の円柱状の固形半田8と接続不良の「浮き」状態の半田ポール3及び半田6とでは、図10の検査方法にてX線11を例えば真上から照射した場合に得られる検査画像のパターンは、図11(a)に示すように略円形となる。すなわち、接続良好な部分の検査画像12も接続不良な部分の検査画像13も略同じ形とな

り、良又は不良の判定はほとんどできなかった。

【0006】これに対して、図10において、プリント 配線基板7を例えば適宜の角度hetaで傾斜させ、BGAパ ッケージ1の接続部分にX線11を斜め方向から照射す るようにした方法が提案されている。しかし、この場合 でも、上記のように基本的にBGAパッケージ1の半田 ポール3の平面形状(略円形)とプリント配線基板7の 半田6の平面形状(略円形)とが略同等となっている限 り、得られる検査画像のパターンは図11 (b) に示す ように略長円形となるだけであり、接続良好な部分の検 10 査画像14も接続不良な部分の検査画像15も略同じ形 となり、良又は不良の判定は難しいものであった。

【0007】さらに他の方法としては、図10におい て、プリント配線基板7に平行にX線源9を一方から他 方に矢印Aのように移動させると共に、X線検出器10 を上記と反対方向に矢印Bのように移動させながら、B GAパッケージ1の接続部分にX線11を照射してその 透過X線像を検出し、接続半田部分の断層像を再構成し て検査する方法が提案されている。しかし、この場合 は、BGAパッケージ1の接続状態の良否を検査するこ 20 とはできるが、検査装置の構造及び画像処理が非常に複 雑となると共に、高価となるものであった。

【0008】そこで、本発明は、このような問題点に対 処し、相手側のプリント配線基板に対するBGAパッケ ージの接続状態の良否を容易に検査可能とすることがで きるボールグリッドアレイバッケージの接続構造及びそ の接続検査方法を提供することを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明によるボールグリッドアレイバッケージの接 30 続構造は、底面に端子として半田ボールを2次元のアレ イ状に配列して成るボールグリッドアレイパッケージの 上記半田ボールと、表面に設けられたバッド上に半田を 印刷して成る相手側のプリント配線基板の上記パッド上 の半田とを位置合わせし、それらを加熱溶融することに よりプリント配線基板にポールグリッドアレイパッケー ジを半田付けするポールグリッドアレイパッケージの接 続構造において、上記ボールグリッドアレイバッケージ の半田ポールの平面形状と、プリント配線基板のパッド 上の半田の平面形状とを相互に異なった形状とし、その 40 いる。 平面形状内で互いに位置合わせ可能としたものである。

【0010】そして、相互に異なった半田の平面形状と して、上記ボールグリッドアレイバッケージの半田ボー ルの平面形状を略円形とし、プリント配線基板のパッド 上の半田の平面形状を上記半田ボールの平面形状を内側 に含んだ大きさの多角形状としてもよい。

【0011】また、本発明によるボールグリッドアレイ パッケージの接続検査方法は、ボールグリッドアレイバ ッケージの底面に端子として2次元のアレイ状に配列さ れた半田ボールの平面形状と、相手側のブリント配線基 50 形としてある。

板の表面に設けられたパッド上に印刷された半田の平面 形状とを相互に異なったものとしておき、上記ボールグ リッドアレイパッケージの半田ボールとプリント配線基 板のパッド上の半田とをその平面形状内で互いに位置合 わせし、それらを加熱溶融することによりプリント配線

基板にポールグリッドアレイパッケージを半田付けした 後に、X線を上記プリント配線基板の真上又は真下から 照射し、X線検出器でその透過X線像を検出し、それら から得られる検査画像のパターンを解析して半田付けの

接続状態の良否を判定するものである。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付 図面に基づいて詳細に説明する。 図1は本発明によるボ ールグリッドアレイバッケージの接続構造におけるBG Aパッケージ1の実施例を示す正面図及び底面図であ り、図2は相手側のプリント配線基板7′の実施例を示 す正面図及び平面図である。BGAパッケージ1は、近 年開発され電子部品の小型、軽量、多機能化を実現する 新しい表面実装タイプのICパッケージであり、外部端 子として従来のリードを用いず、パッケージの底面に配 列された半田ボールを端子として接続する方式の電子部 品である。すなわち、図1 (a) において、パッケージ 本体2は、内部に半導体チップを封止してモールド樹脂 で覆ったものである。そして、上記パッケージ本体2の 底面には、パッド4、4、…がマトリクス状に配置され ており、このパッド4,4,…上に例えば共晶半田で球 状に形成された半田ボール3が実装され、図1 (b) に 示すように略全面にマトリクス状に形成されている。こ れにより、底面に外部端子として半田ボール3,3,… を2次元のアレイ状に配列して成るBGAパッケージ1 が構成されている。

【0013】プリント配線基板7′は、上記BGAパッ ケージ1を接続する相手側の部品となるものである。す なわち、図2(a)において、回路基板の表面にバッド 5,5,…がマトリクス状に配置されており、このバッ ド5,5,…上に例えば低融点クリーム半田 (Sn-P b-Bi)で四角形状に形成された半田6が印刷され、 図2(b)に示すように上記図1(b)に示す半田ボー ル3のマトリクスに対応するマトリクス状に形成されて

【0014】ここで、本発明においては、上記BGAバ ッケージ1の半田ボール3の平面形状と、プリント配線 基板7′のパッド5上の半田6の平面形状とを相互に異 なった形状とし、その平面形状内で互いに位置合わせ可 能とされている。すなわち、図1(b)に示すように上 記BGAパッケージ1の半田ポール3の平面形状を略円 形とし、図2(b)に示すようにプリント配線基板7° のパッド5上の半田6の平面形状を上記半田ボール3の 平面形状を内側に含んだ大きさの多角形状、例えば四角

【0015】そして、このような状態でBGAパッケー ジの接続構造は、図3に示すように、底面に端子として 半田ポール3を2次元のアレイ状に配列して成るBGA パッケージ1の上記半田ポール3と、表面に設けられた パッド5上に半田6を印刷して成る相手側のプリント配 線基板7′の上記パッド5上の半田6とを位置合わせ し、一括リフロー方式でそれらを加熱溶融することによ りプリント配線基板 7′ にBGAパッケージ1を半田付 けするようになっている。このときの、プリント配線基 板7′とBGAパッケージ1との接続状態は、図4に示 すようになる。すなわち、BGAパッケージ1の半田ボ ール3とプリント配線基板7′の半田6とが十分に接合 されている場合は、溶けた半田の表面張力により円柱状 の固形半田8となり、接続良好となる。また、場所によ ってBGAパッケージ1の半田ポール3とプリント配線 基板7′の半田6とが接合されていない場合は、半田ボ ール3と半田6とがやや離れた状態で固まり、いわゆる 「浮き」となって電気的に接続されず接続不良となる。 【0016】このようなBGAパッケージ1の接続状態 における半田の形状を拡大して示すと、図5のようにな 20 る。すなわち、接続良好な場合は、図5(b)に示すよ うに、図3に示す半田ポール3と半田6とが溶けてその 表面張力により円柱状になって固まり、その断面形状は 略円形となる。また、接続不良の場合は、図5 (a) に 示すように、図4において半田ボール3と半田6とがや や離れて「浮き」となった状態で固まっており、上方か ら透視した形状は半田ボール3の略円形とやや大きい半 田6の四角形とが重なり、全体としては半田6の四角形 となっている。従って、図5に示す半田の形状の相違か ら、これらを上方又は下方から透視することにより、略 30 円形と四角形とでBGAパッケージ1の接続状態の良否 を容易に判定することができるようになる。なお、図2 及び図5においては、プリント配線基板7′の半田6の 平面形状を四角形としたが、本発明はこれに限らず、B GAパッケージ1の半田ポール3の平面形状を内側に含

【0017】次に、上記のようなBGAパッケージ1の 接続状態の良否を検査する接続検査方法について、図1 ~図7を参照して説明する。まず、図1に示すBGAバ 40 ッケージ1の底面に端子として2次元のアレイ状に配列 された半田ポール3の平面形状と、図2に示す相手側の プリント配線基板 7′ の表面に設けられたパッド5上に 印刷された半田6の平面形状とを相互に異なったものと しておく。次に、図3に示すように、上記BGAパッケ ージ1の半田ボール3とプリント配線基板71のパッド 5上の半田6とをその平面形状内で互いに位置合わせす る。この状態で、図4に示すように、一括リフロー方式 でそれらを加熱溶融することによりプリント配線基板 7′にBGAパッケージ1を半田付けする。

んだ大きさの多角形状であるならば、三角形、五角形、

六角形などとしても良い。

【0018】その後、図6に示すように、X線源9とX 線カメラ等のX線検出器10とを対向配置して成るX線 透視装置の上記X線源9とX線検出器10との間に、上 記BGAパッケージ1を半田付けしたプリント配線基板 7′をセットする。そして、上記X線源9によりX線1 1を上記プリント配線基板7′の真上又は真下から照射 し、X線検出器10でその透過X線像を検出する。次 に、このX線検出器10で検出した透過X線像を図示外 の画像処理装置などで処理し、検査画像のバターンを解 析して半田付けの接続状態の良否を判定する。このと き、図7に示すように、図5 (b) に示す接続良好な部 分についての検査画像16は略円形となり、図5 (a) に示す接続不良な部分についての検査画像17は四角形 等の多角形状となる。従って、これらの検査画像16、 17について、その画像特徴量を抽出したり、画像の輝 度変化などを検出して、略円形と多角形状とで接続良好 と接続不良とを識別し半田付けの接続状態の良否を容易 に判定することができる。

[0019]

【発明の効果】本発明によるボールグリッドアレイパッ ケージの接続構造は以上のように構成されたので、BG Aパッケージの半田ボールの平面形状と、プリント配線 基板のバッド上の半田の平面形状とを相互に異なった形 状とし、その平面形状内で互いに位置合わせ可能とした ことにより、接続部分の半田の形状を明確に区別できる ようにして、相手側のプリント配線基板に対するBGA パッケージの接続状態の良否を容易に検査可能とするこ とができるようになる。

【0020】特に、BGAパッケージの半田ボールの平 面形状を略円形とし、プリント配線基板のパッド上の半 田の平面形状を上記半田ボールの平面形状を内側に含ん だ大きさの多角形状としたものにおいては、接続部分の 半田の形状をより明確に区別することができ、接続状態 の良否の検査精度を向上することができる。

【0021】また、本発明によるボールグリッドアレイ パッケージの接続検査方法は以上のように構成されたの で、上記BGAバッケージの半田ボールとプリント配線 基板のパッド上の半田とをその平面形状内で互いに位置 合わせし、それらを加熱溶融することによりプリント配 線基板にBGAパッケージを半田付けした後に、X線を 上記プリント配線基板の真上又は真下から照射し、X線 検出器でその透過X線像を検出し、それらから得られる 検査画像のパターンを解析することにより、BGAバッ ケージの半田付けの接続状態の良否を判定することがで きる。この場合、X線の照射はプリント配線基板の真上 又は真下から行うだけでよいので、該プリント配線基板 を傾斜させたり、X線源及びX線検出器を互いに反対方 向に移動させたりする必要はなく、検査装置の構造及び 画像処理が非常に簡単となると共に、費用を格段に安く 50 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるボールグリッドアレイパッケージ の接続構造におけるBGAパッケージの実施例を示す正 面図及び底面図である。

【図2】本発明のボールグリッドアレイパッケージの接 続構造における相手側のプリント配線基板の実施例を示 す正面図及び平面図である。

【図3】上記BGAパッケージと相手側のプリント配線 基板とを位置合わせした状態を示す正面図である。

【図4】上記位置合わせした状態で半田を加熱溶融し、 プリント配線基板にBGAパッケージを半田付けした接 続状態を示す断面図である。

【図5】上記BGAバッケージの接続状態における半田 の形状を拡大して示す説明図である。

【図6】本発明によるボールグリッドアレイパッケージ の接続検査方法を説明するための検査概要図である。

【図7】上記本発明による接続検査方法で得られた検査 画像のパターンを示す説明図である。

【図8】従来のポールグリッドアレイパッケージの接続 構造においてBGAパッケージと相手側のプリント配線 20 16,17…検査画像 基板とを位置合わせした状態を示す正面図である。

【図9】上記位置合わせした状態で半田を加熱溶融し、 プリント配線基板にBGAパッケージを半田付けした接 続状態を示す断面図である。

8

【図10】従来例におけるボールグリッドアレイパッケ ージの接続検査方法を説明するための検査概要図であ る。

【図11】上記従来例における接続検査方法で得られた 検査画像のパターンを示す説明図である。

【符号の説明】

10 1…BGAパッケージ

2…パッケージ本体

3…半田ボール

4,5…パッド

6…半田

7′…プリント配線基板

9…X線源

10…X線検出器

11…X線

11′…透過X線像

【図1】 【図2】 00000 000000 000000 **(b)** (b) 00000 000000 0000 【図3】 【図4】 [図6] 【図9】

